

PHYNIX

Surfix®

Podr°czny
miernik do badania gruboœci pow-ok
z menu typu telefonu komórkowego



Nowo÷j

Nowoczesny, szybki, praktyczny
Surfix® Miernik do badania gruboœci pow-ok
na pod-o±ach ferro i nieferromagnetycznych

Surfix®

Czym wyróżnia się Surfix®?

Surfix® to przenośny miernik do szybkich, precyzyjnych, nieingerencyjnych pomiarów grubości wszystkich niemagnetycznych powłok takich jak lakiery, farby, powłoki anodowane, izolacyjne na stali węglowej jak i na metalach nieelastycznych i stali austenitycznej.

Surfix® został zaprojektowany tak, aby znaleźć zastosowanie przy pomiarach zarówno w laboratoriach jak i w ciężkich warunkach prac polowych. Unikalna obudowa IP52 zapewnia ochronę przeciwpowodziową oraz odporność na kapieć wodną.

Surfix® gwarantuje prostą obsługę poprzez wprowadzenie menu typu telefonu komórkowego. Posiada jasną i przejrzystą instrukcję obsługi. Wbudowana funkcja pozwalająca na wybór jednego z czterech języków (w tym również opcjonalnie języka polskiego) zmniejsza ryzyko popełnienia błędów wynikających z niewłaściwej interpretacji słów.

Surfix® posiada unikalnej konstrukcji sondę z sensorem kontaktowym. Ogranicza ona do minimum nacisk na mierzoną powłokę, pozwala dokonywać pomiarów na miękkich powłokach oraz powłokach o wysokiej gładkości i poślisku, nie pozostawiając na nich śladów. Jej konstrukcja umożliwia pomiary w trudnych miejscach o małej powierzchni, poprzez zdjęcie plastikowej końcówki sondy.

Surfix® umożliwia bezpośredni odczyt wszystkich istotnych informacji także z bieżących obróbek statystycznych na alfanumerycznym wyświetlaczu.

Surfix® pozwala na łatwą obróbkę danych statystycznych, szybki, bezprzewodowy transfer danych zarówno do komputera jak i do drukarki, przy wykorzystaniu najnowszej technologii przesyłu danych przez podczerwieć.

Gdzie można wykorzystać Surfix®:

Wszędzie gdzie nakładane są powłoki - w celu antykorozyjnego, mechanicznego, czy ułecznego zabezpieczenia powierzchni - oszacowanie grubości powłoki jest jednym z podstawowych kryteriów określających jakość prac aplikacyjnych.

Surfix® jest idealnym miernikiem do szybkiego, nieniszczącego i dokładnego pomiaru grubości powłok znajdującym zastosowanie:

Kompaktowy i nowoczesnie zaprojektowany Surfix® umożliwia przejrzysty przegląd menu operacyjnego na łatwo czytelnym alfanumerycznym wyświetlaczu. Wystarczy przyłożyć sondę do pokrytej powierzchni metalowej dla uzyskania szybkiego, nieniszczącego cyfrowego pomiaru grubości w μm lub μcalach .



- w sklepach z farbami, galwanizacjach
- przy pomiarze grubości powłok proszkowych oraz nakładanych na mokro,
- w przemysłach motoryzacyjnym,
- przy badaniach jakości powłok półproduktów, produkcji w toku, oraz wyrobów końcowych,
- przy badaniach laboratoryjnych, inspektorskich w instytutach badawczych
- przy pomiarach związanych z przemysłowymi zabezpieczeniami antykorozyjnymi
- w zakładach przemysłowych i warunkach polowych.



Surfix® zalecany jest do pomiarów grubości:

- wszystkich powłok niemagnetycznych jak lakier, farba, emalia, chrom, miedź, cynk na podłożach ze stali węglowej i żelaza
- wszystkich powłok izolacyjnych takich jak lakier, farba, ceramika i powłoki anodowane na metalach nieferromagnetycznych.
- w miejscach trudno dostępnych np. szczelinach o szer. min. 5mm (pozwala na to odkręcana, plastikowa końcówka sondy).

- Surfex® to lekki miernik o budowie kompaktowej przeznaczony dla użytkowników, którzy wymagają nowoczesnych rozwiązań technologicznych połączonych z prostotą obsługi i łatwością dokonywania pomiarów.
- Proste menu łatwo prowadzi użytkownika po funkcjach przyrządu oraz pozwala na wybór języka najbardziej dla niego zrozumiałego.
- Surfex® daje możliwość nieniszczącego badania grubości powłok na podłożach ferrowych i nieferromagnetycznych.
- Surfex® automatycznie rozpoznaje rodzaj podłoża i przełącza się na właściwą procedurę pomiarową bez konieczności przerywania pomiarów.
- Surfex® nie wymaga kabli podłączeniowych do komputera lub drukarki, dzięki zastosowaniu techniki przesyłu danych na podczerwień.
- Bezpośredni nacisk końcówki sondy na podłoże ograniczony jest do minimum, co pozwala na dokonywanie pomiarów na delikatnych, gładkich, o wysokim połysku powłokach bez pozostawiania na nich śladów lub zarysowań.
- Zakres pomiarowy: 0-1500 μm
- Możliwość statystycznej obróbki danych do 10 000 odczytów tzn. ilość pomiarów, średnia wartość, odchylenie standardowe, minimalna i maksymalna wartość pomiaru.

Statystyczna obróbki danych:

Nowe rozwiązanie "Online Statistics" pozwala na odczytywanie na bieżąco na wyświetlaczu aktualnej wartości pomiaru oraz statystyki dokonanych pomiarów w następujących opcjach:

- n (ilość pomiarów), \bar{x} (wartość średnia), s (odchylenie standardowe)
 - n (ilość pomiarów), max (maksymalna wartość odczytu), min (minimalna wartość odczytu)
- Pierwsze 80 odczytów wraz z ich obróbką statystyczną jest przechowywane w pamięci miernika i może być wywołane na żądanie.

Transfer danych:

Technologia przesyłu danych na podczerwień (norma IrDA) pozwala na transfer informacji do komputera, lub notebooka wyposażonego w odpowiedni odbiornik podczerwieni lub opcyjnie oferowany kabel z takim odbiornikiem. Nie ma konieczności używania dodatkowych kabli, co zaoszczędza czas związany z podłączaniem przewodów.

Istnieje również możliwość przekazywania danych do PC lub drukarki przy użyciu zwykłego kabla RS 232.



Physikalische Oberflächen-Messtechnik
Physical Surface Testing Technology

Dane techniczne:

Zasady pomiaru

Indukcja magnetyczna dla wersji F, Prtdy wirowe dla wersji N
Sonda automatycznie w czasie pracy rozpoznaje rodzaj pod-o±a

Zasady pomiaru	0... 1500 µm
Tolerancja	± (1 µm + 3% warto-ci odczytu)
Rozdzielczo-÷	0,1 µm lub < 2 % odczytu
Wy-wietlacz	Automatyczne pod-wietlanie, 4-cyfrowy pod-wietlasz alfanumeryczny, max. Wysoko-÷ wy-wietlanych cyfr 10 mm
Minimalna powierzchnia pomiarowa	5 mm x 5 mm
Minimalny promie-z zakrzywienia powierzchni pomiarowej	Wypuk-y: 3 mm, wkl°s-y: 50 mm
Minimalna grubo-÷ pod-o±a	typ F: 0.5 mm, typ N: 50 µm.
Kalibracja	Kalibracja fabryczna, zerowanie na p-ytce, zerowanie na folii
Statystyka	Ilo-÷ pomiarów, warto-÷ ±rednia, odchylenie standardowe, warto-÷ max i min. (obróbka statystyczna dla 10 000 odczytów)
Pami° i	max. 80 odczytów, pojedynczych lub z warto-ciami statystycznymi
Granice pomiarowe	Mo±liwo-÷ ustawienia akustycznego sygna-u alarmowego
Przekazywanie danych do drukarki lub komputera	Bezprzewodowo na podczerwie-z, lub standardowym kablem RS 232
Temperatura pracy	0 ... 50 °C /32°F...122°F
Wy-tczanie	Automatyczne
Zasilanie	2 x baterie alkaliczne (AA) 1.5 V, do 50 h pracy
Wymiary	Miernik: 140 mm x 62 mm x 30 mm sonda: R 14 mm x 83 mm
Waga	200 g (miernik + sonda)
Klasa ochrony	IP 52 (szczelno-÷ na py-i kapitca wod°)
Normy	DIN, ISO, ASTM, BS
Gwarancja	1 rok, nie obejmuje uszkodze-z mechanicznych oraz naturalnego zu-ycia g-owicy sondy

Podstawowe wyposa±enie:

Miernik wraz z sond±
P-ytki kalibracyjne (ze stali nierdzewnej)
2 folie kalibracyjne
2 baterie
Etui ochronne
Instrukcja obs-ugi

Dodatkowe wyposa±enie:

Oprogramowanie PC do transferu danych,
Kabel do komputera z odbiornikiem na podczerwie-z,
Drukarka TA 210 z wbudowanym odbiornikiem na podczerwie-z,
Folie kalibracyjne o r°-nych grubo-ciach.

Dystrybutor:



PHYNIX

Physikalische Oberflächen-Messtechnik
Physical Surface Testing Technology

PHYNIX GmbH & Co.KG
Heinrich-Pesch-Straße 12, D-50739 Köln
Telefon ++49 (0)221/17 96 4-30
Telefax ++49 (0)221/17 96 4-35
e-Mail: info@phynix.com
Internet: http://www.phynix.com